# 3-5. 低速陽電子グループ

# 兵頭 俊夫 物質構造科学研究所放射光科学第一研究系

# 1. 概要

低速陽電子グループは、物質の最表面の結晶構造と物性 との関係の解明,陽電子やポジトロニウム(Ps),Ps負イ オンといった粒子の基礎的な性質の解明,それらの粒子と 物質との相互作用の解明を目的として,全反射高速陽電子 回折(TRHEPD)測定装置や低速陽電子回折(LEPD)測 定装置,Ps負イオン実験装置,ポジトロニウム飛行時間 (Ps-TOF)測定装置などを用いて研究を進めている。スタ ッフは,自身の研究と共に,ビームライン・ステーション の最適化や研究開発を行い,その上で共同利用研究を推進 する。

構成ビームライン・実験ステーション名と担当者名は下 記のとおり。

BL・実験 ステーション	担当者		備考(ユーザー運営, 大学運営など)
SPF-A3: TRHEPD	兵頭	俊夫,	整備には日本原子力研究
ステーション	望月	出海	開発機構深谷氏が協力
SPF-A4: LEPD ステ	兵頭	俊夫,	整備には量子科学技術研
ーション	望月	出海	究開発機構和田氏, 産業
			技術総合研究所白澤氏が
			協力
SPF-B1: 汎用陽電	兵頭	俊夫,	現在は Ps 負イオン - 実験
子実験ステーショ	望月出	海	装置が設置されている。
ン			整備には東京理科大学長
			嶋研が協力
SPF-B2: Ps-TOF ス	兵頭	俊夫,	整備には東京理科大学長
テーション	望月	出海	嶋研, 量子科学技術研究
			開発機構河裾グループが
			協力

## 2. 活動内容

【グループとして推進している研究】全反射陽電子回折 (TRHEPD) および低速陽電子回折 (LEPD) による表面構 造および表面直下の格子緩和の研究,および Ps 飛行時間 (Ps-TOF) 法による表面研究。現在多くの成果が出つつあ る全反射高速陽電子回折 (TRHEPD) をさらに発展させ, 数多くの表面科学の重要問題に関係する原子配列を陽電子 回折によって解決する。2016 年度は,新規な表面構造の 作製や表面特性の発現に挑戦しているグループ等からの問 い合わせが 3 件あり,2 グループは年度内に共同利用を開 始し,1 グループは 2017 年度からの共同利用を申請して 採択された。また,外部予算獲得により進めていた低速陽 電子回折 (LEPD) ステーション (SPF-A4) が完成した。 【ビームライン整備】当グループが管理するビームライン 分岐のステーションは、様々な研究者が in situ で試料を作 製して実験を行うため、試料作製/モニター環境に対する さまざまなニーズがある。まだそれらに十分対応できる環 境になっておらず、予算の範囲で、希望の強いものを整備 している。

【グループ内活動】月に1度グループミーティングを開催 し,情報交換,活動報告,研究報告,今後の方針等の議論 を行っている。

#### 3. 今後の展望

TRHEPDでは、全反射条件で最表面だけの情報を得られるだけでなく、視射角を臨界角より大きくすることで表面直下の原子配置の情報も得られる。これまでに引き続き、構造の起伏が大きいために確定していない表面について、TRHEPDによる解明に挑戦する。また、最近盛んに合成されている単原子層物質の構造は基板の物質の種類によって多様である。その中でも表面科学的に重要なものについて構造を解明する。

LEPD では,低速電子回折(LEED)で行われている I-V 曲線解析のほか,LEED では難しいホログラフィー法やパ ターソン法などの手法開発を進める。

汎用ステーションでは Ps 負イオンの研究が一段落した ので、Ps のボースアインシュタイン凝縮のために将来必 要となる Ps のレーザー冷却の測定を検討する。

Ps-TOF では、引き続き金属、半導体、絶縁体表面について、Ps 生成と放出を通じた電子構造の研究を展開する。 また、ユーザー増加にともなって、測定時間短縮のための 低速陽電子ビーム強度増強の希望が出ている。現状は、リ ニアック出力の最大定格が本施設の放射線シールドで制限 されている。天井が厚く放射線シールドの容易な北側の旧 テスト・リニアック室に陽電子生成ターゲットを移設す れば、加速管も一段追加が可能になり、最小限の費用で ビーム強度を増強することができる。強度が一桁増して 10<sup>8</sup> e<sup>+</sup>s 以上になると、多くの共同利用ユーザーの受け入 れが可能になる。パルスストレッチと組み合わせて、2次 元 2 光子角相関(2D-ACAR)法による表面近傍の電子-陽電子対の運動量分布の測定も短時間で可能になる。

また,日本陽電子科学会が提出した低速陽電子研究施設 計画は学術会議の学術の大型研究計画のリストに含められ ており,今後大型計画が実現する場合,本施設がその中心 施設として大きな役割を果たすことが期待される。低速陽 電子実験施設では,今後もこのような新しい陽電子研究を 推進してゆきたい。

# SPF-A3:全反射高速陽電子回折(TRHEPD)ステーション

兵頭 俊夫<sup>1</sup>,望月 出海<sup>1</sup>,深谷 有喜<sup>2</sup> <sup>1</sup>物質構造科学研究所放射光科学第一研究系,<sup>2</sup>日本原子力研究開発機構

#### 1. 概要

本ステーションでは, KEK-PF 低速陽電子実験施設(slow positron facility, SPF)の専用リニアックで生成されたロ ングパルスモードの高強度・高輝度低速陽電子ビーム[1, 2]をもちいて,全反射高速陽電子回折[3](total-reflection high-energy positron diffraction, TRHEPD)実験を行ってい る。

ここでは、大きさ 10 mm×5 mm×0.5 mm 程度に切り出 した試料に、10 keV 程度に加速した陽電子ビームをすれ すれ視射角で打ち込み、進行方向に配置したスクリーンに 現れる回折パターンを撮影する(図 1)。入射陽電子ビー ムに対する試料の視射角と方位角はマニピュレータにより 自動調整でき、視射角変化させながらパターン取得する方 法(ロッキング曲線)に加えて、方位角変化させながらパ ターン取得する方法(方位角プロット)も測定できる。

また, 試料の通電・電子衝撃加熱(室温~1800 K 程度), ヘリウム冷凍機とヒーターを併用した低温域の試料温度制 御(20 K ~ 250 K 程度)が可能で,本エンドステーション における in situ 試料作製にも幅広く対応できる。

#### 2. 整備開発および運用状況

2016年度は以下の高度化整備を実施した。①電子衝撃 加熱型3源エバポレータを導入し,複数の高融点物質蒸着 が必要な試料作製に対応できるようになった。②試料交換 用ロードロックを更新し,試料を内部でストックできるよ うにした。これにより試料交換時の真空回復作業(~8時間) が不要となり,ビームタイムを効率良く測定時間に費やせ るようになった。

現在,実験チェンバーには,TRHEPD 測定システムの 他に以下が常設されている:RHEED 装置,Ar<sup>+</sup>イオンス パッタ装置,蒸着源用ポート(ICF70×4),電子衝撃加熱型 3 源エバポレータ,Ar ガス導入,O<sub>2</sub> ガス導入,H<sub>2</sub> ガス導 入,試料通電/電子衝撃加熱機構,試料冷却/温度制御機構, 試料交換ストック用ロードロック機構,試料ホルダ×3, 試料温度測定用放射温度計。



図1 TRHEPD 実験配置

# 3. ビームタイム利用状況

SPFでは、一台の専用リニアックで生成した低速陽電子 ビームを、輸送ラインの途中で4本(SPF-A3, A4, B1, B2) に分岐して、ビームタイム毎のタイムシェア形式で共同利 用に供している。SPF-A3のビームタイムは、他の3本と 一体で実験審査委員会(PAC)の評点に基づいた日程配分 が行われる。どの課題も、統計をためることが必要な蓄積 型実験なので、1課題に対して概ね5日間を割り振ってい る。ビームタイム開始前の事前準備や、ビームタイム開始 時のビーム輸送パラメータのセットアップは、休日関係無 しに、基本的に内部スタッフが対応している。十分経験の あるユーザーに関しては、輸送パラメータの変更などを各 自で行なうことが可能になりつつある。

2016年度に本ステーションを利用した課題は、「(S2) 全反射高速陽電子回折を用いた最表面構造決定」、「(G) Ge(110)2×16超構造のTRHEPD測定」、「(G)触媒担体 材料結晶の表面構造解明のための全反射高速陽電子回 折(TRHEPD)を用いた新手法開発」、「(G)アナターゼ 型酸化チタン表面の構造解析と金属絶縁体転移の研究」、 「(G)反射高速陽電子回折によるAg(100)上のバナジウム 酸化物超薄膜の構造解析」、「(G)全反射高速陽電子回折 (TRHEPD)法による2層グラフェン層間化合物の表面構 造解析」である。

2015 年度末に出版したルチル型 TiO<sub>2</sub>(110) (2 × 1) 表面の 構造決定 [4],及び Cu(111) 面上および Co(0001) 面上のグ ラフェンと基板の間の距離の決定 [5] に引き続いて,2016 年度は,Al(111) 面上のゲルマネンのバックリングが図 2 のように非対称的になっていることを発見した [6]。



図 2 Al(111) 面上の非対称なグラフェン [6]

# 4. 今後の展望

TRHEPD の認知度が次第に上がり,2013 年以降共同 利用ユーザーは着実に増加している。今後も引き続き, TRHEPD の表面構造に対する超高感度性を活かした,グ ラフェンに代表される単原子層物質,新しく合成された超 薄膜物質,表面の特性が重要な触媒物質などの構造解析が 行われる予定である。一方で,ビームタイム配分率は圧迫 されており,このままでは慢性的にビームタイム不足が生 じると予想される。これを当面解決するため,ユーザーか らは,試料交換や in situ 試料作製を効率化するための試料 準備槽の整備が強く要望されており,早急の予算確保を目 指している。さらに本格的な解決策としては,専用リニア ックの増強による低速陽電子の強度 10 倍増を構想してい る。

# 引用文献

- K. Wada, T. Hyodo, A. Yagishita, M. Ikeda, S. Ohsawa, T. Shidara, K. Michishio, T. Tachibana, Y. Nagashima, Y. Fukaya, M. Maekawa and A. Kawasuso, Eur. Phys. J. D 66, 37 (2012).
- [2] M. Maekawa, K. Wada, Y. Fukaya, A. Kawasuso, I. Mochizuki, T. Shidara and T. Hyodo, Eur. Phys. J. D 68, 165 (2014).
- [3] A. Ichimiya, Solid State Phenom. 28/29, 143 (1992).
- [4] I. Mochizuki, H. Ariga, Y. Fukaya, K. Wada, M. Maekawa, A. Kawasuso, T. Shidara, K. Asakura and T. Hyodo, Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 7085 (2016). http://www.kek.jp/ja/NewsRoom/Release/20160224140000/ (KEK プレスリリース)
- [5] Y. Fukaya, S. Entani, S. Sakai, I. Mochizuki, K. Wada, T. Hyodo, S. Shamoto, Carbon 103, 1 (2016). http://www. kek.jp/ja/NewsRoom/Release/20160307150000/ (KEK プレスリリース).
- [6] Y. Fukaya, I. Matsuda, B. Feng, I. Mochizuki, T. Hyodo, S. Shamoto, 2D Materials **3**, 035019 (2016). http://www.kek.jp/ja/NewsRoom/Release/pressrelease20160913.pdf (KEK プレスリリース).

# SPF-A4:低速陽電子回折(LEPD)ステーション

兵頭 俊夫<sup>1</sup>,望月 出海<sup>1</sup>,和田 健<sup>2</sup>,白澤 徹郎<sup>3</sup>,藤浪 眞紀<sup>4</sup>,前川 雅樹<sup>2</sup>,河裾 厚男<sup>2</sup> <sup>1</sup>物質構造科学研究所放射光科学第一研究系, <sup>2</sup>量子科学技術研究開発機構<sup>,3</sup>産業技術総合研究所,<sup>4</sup>千葉大学

# 1. 概要

SPF-A4 では, KEK-PF 低速陽電子実験施設 (Slow positron facility, SPF)の専用リニアックのロングパルス モードで生成された高輝度・高強度低速陽電子ビームを 用いた, 低速陽電子回折 (Low-energy positron diffraction, LEPD)実験ステーションの開発が行なわれている。LEPD 法 [1] は, 結晶表面構造解析の手法である低速電子回折 (Low-energy electron diffraction, LEED)法の陽電子版であ る。

LEPD 測定装置では,陽電子輸送ビームラインとの幾何 学的干渉により,一般の LEED 装置のように回折パター ンを背面からカメラ撮影することが困難なため,遅延アノ ード検出器 (Delay-line detector, DLD)を MCP 背面に配置 してパターンを得る。DLD は 100 ns 程度の間に複数個の 陽電子を多重検出してしまうとパターンを正しく表示でき ないので,多重検出をしないよう陽電子ビームのパルス幅 を伸張して単位時間あたりの陽電子の個数を減らすシステ ムを導入している。

#### 2. 整備開発および運用状況

2015 年度までに,陽電子のパルス幅を伸長するパル スストレッチング(パルス伸張)セクションの開発と, 50 eV から 500 eV のビームを非磁場領域で得るための輝 度増強ユニットの導入を行ない,2016 年度にはそれらの 試験・評価を行うと共に LEPD 実験の共同利用を開始した。



図1 パルス伸長セクション入口電極付近

パルス幅 1.2 µs, 繰り返し 50 Hz のロングパルスモード では,各パルス中に陽電子が 10<sup>6</sup> 個 (単位時間換算で 10<sup>12</sup> 個/s) 程度存在する。これらを多重検出の問題無く検出で きるようにするため,図1に示すような,パルス幅を最小 200 µs から,最大で繰り返し上限の 50 Hz で決まる 20 ms 程度まで任意のパルス幅に引き伸ばすことのできるパルス 伸張セクションを建設し,その動作試験を行なった。

本パルス伸張セクションは、図2の上部に示すように、 ビームラインを内包するコイルと、円筒形の入口ゲート電 極と出口ゲート電極、及びその間の長さ約6mの円筒形の トラップ電極から構成されている。また、パルス伸長セク ションの中心軸に沿ってビームを入射できるよう、その上 流側にビーム位置を調整するステアリングコイルを内包し たソレノイドコイルを設置した。まず、各陽電子パルスを トラップ電極内に蓄積する。陽電子のビームラインに垂直 な方向に関しては、コイルによるビームラインに沿った磁 場で束縛し、ビームラインに沿った方向に関しては、入口 ゲート電極と出口ゲート電極の電位 (> 陽電子ビームエネ ルギー)により束縛する。

動作は図2の下部に示すように行う。出口ゲート電極の 電位 V3 は、ストレッチしたビームのエネルギーが所望の 値になるような一定値に保つ。50 Hz の各パルスの到着に タイミングを合わせて入り口ゲート電極の電位 V1 を下げ て陽電子をトラップ電極の円筒内に導入する。そのパル スの先頭が6m先の出力電極で反射して戻ってくる前に、 V3を V1 より高くして、陽電子を閉じ込める(すなわち、 陽電子が入り口電極と出口電極の間を往復する状態に保 つ)。その後にトラップ電極の電位 V2を徐々に上昇させる。 これにより、一定値に保たれた V3 を越えて少しずつ下流 側に陽電子が溢れ出るので、時間的にパルス幅が広がった 一定エネルギーの陽電子ビームが供給される。パルス伸長



図2 パルスストレッチングセクションの動作の概念図

幅は, V2 の上昇の速さにより調整することができる。動 作試験を行ない, LEPD ステーション手前での輝度増強に 適した 5.2 keV のパルス伸張ビームを得るための諸電源の パラメタを決定した。

リニアックベース低速陽電子ビームのパルス伸張セクシ ョンは、10 eV 程度のエネルギーの陽電子ビーム用に既に 産業技術総合研究所で実用化されている。そこでは、各パ ルスをリニアストレッジした後に出口のゲート電極の電位 を下げていくことで徐々に陽電子を下流側に供給してパル ス幅を広げる方式が採用されている。KEK で開発したパ ルス伸張セクションは、出口のゲート電極が一定のためエ ネルギーの揃った長パルスビームが得られる。原理的には, 各電極の電位の変化を調節することで、元々の陽電子ビー ムよりも高エネルギーの陽電子を得ることも可能である。 伸張された陽電子ビームは引き続き磁場輸送されるが、こ れを回折実験に利用するには、まずは非磁場領域へ解放し つつ必要なビーム輝度を確保しなければならない。そのた め、厚さ 150 nm の Ni 薄膜を用いた透過型リモデレータに よるビーム輝度増強システムを開発し、50 eV から 500 eV 程度の高輝度低速陽電子ビームを輸送するためのレンズ系 を構築した。

構築した装置を用いて、実際に LEPD 実験を試みたと ころ、輝度増強ユニットで9割方消滅する陽電子の消滅γ 線によるバックグラウンドが強く、MCP-DLD による回折 パターンの観測に支障があることが判明した。MCP は陽 電子消滅γ線に対して0.1%のオーダーの検出効率しか無 いが、回折パターンを形成する陽電子の試料表面からの後 方弾性散乱の確率も同程度に低いため、このような問題が 生じていることがわかった。そこで、輝度増強ユニットか らのγ線を遮蔽するための厚さ1 cm のタングステンの板 を DLD の背面に設置し、かつ MCP の出力信号のパルス 波高分析をし、減衰指数関数的に分布する γ 線由来の信 号と、ガウシアン的に分布する陽電子由来の信号を波高弁 別する測定系を構築した。これらにより、バックグラウン ドを1桁低減することができた。

また,使用している試料ホルダがチャージアップして LEPD 回折パターンが取得できないという問題も判明し た。LEPD 実験はビーム強度が十分弱いので,たとえ絶縁 体試料であっても陽電子ビームによるチャージアップの 問題は生じないが,試料表面を作成する時に使用する Ar<sup>+</sup> スパッタや RHEED 測定により,試料ホルダの絶縁部品 がチャージアップし得る。試料ホルダが Ar<sup>+</sup> スパッタや RHEED でチャージアップしないよう,改造を行なった。

### 3. ビームタイム利用状況

SPFでは、一台の専用リニアックを用いて生成した低速 陽電子ビームの輸送ラインの途中に分岐を作り、4本の分 岐ビームライン(SPF-A3, A4, B1, B2)で、ビームタイム 毎のタイムシェア形式で共同利用に供している。2016年 度に SPF-A4 を利用した課題 は、「(G) リニアックベース 高強度低速陽電子ビームを用いた低速陽電子回折実験装置 の開発」と「(S2) 低速陽電子回折法による表面構造解析」 である。

#### 4. 今後の展望

陽電子は電子と比較して,結晶中の多重散乱が少ないこ と,陽電子と電子との間に交換相互作用が無く,また原子 核からの反発により相対論的効果が小さいため散乱因子が 単純であること,平均自由行程が短くより表面敏感である こと,という利点があり,LEEDと比較して実験と理論計 算が良く一致することがわかっている[2-4]。LEED法は表 面構造解析の強力な手法ではあるが,とりわけ重元素を含 む系では散乱が複雑となり解析が困難になる場合がある。 LEPD法の持つ利点はLEED法における困難を生じないこ とを示唆している。また,LEED法では困難な表面ホログ ラフィーがLEPDでは可能であることも理論的に予想され ている[5]。

2016 年度に開始した LEPD 実験は,輝度増強ユニット からの消滅γ線によるバックグラウンドの問題と Ar<sup>+</sup> スパ ッタや RHEED 測定による試料ホルダのチャージアップの 問題を解決した。2017 年度にはまずは LEPD パターンの 測定を目標とし,続いてホログラフィー法や I-V による表 面構造解析を行なえるよう整備を進めていく。

# 引用文献

- I. J. Rosenberg, A. H. Gneiss, and K. F. Canter, Phys. Rev. Lett. 44, 1139 (1980).
- [2] T. N. Horsky, G. R. Brandes, K. F. Canter, et al., Phys. Rev. Lett. 62, 1876 (1989).
- [3] C. B. Duke and D. L. Lessor, Surf. Sci. 225, 81 (1990).
- [4] S. Y. Tong, Surf. Sci. Lett. 457, L432 (2000).
- [5] S. Y. Tong, H. Huang, and X. Q. Guo, Phys. Rev. Lett. 69, 3654 (1992).

# SPF-B1:汎用陽電子実験ステーション

兵頭 俊夫<sup>1</sup>,望月 出海<sup>1</sup>,長嶋 泰之<sup>2</sup>,満汐 孝治<sup>2\*</sup> <sup>1</sup>物質構造科学研究所放射光科学第一研究系,<sup>2</sup>東京理科大学

#### 1. 概要

本汎用ステーションは、低速陽電子実験施設(slowpositron facility, SPF)の低速陽電子ビームの特長(高強 度であること、およびパルス状であること)を利用した 種々の研究のために用意されている。現在は、ポジトロ ニウム (Ps) 負イオン実験装置が設置されている。現在 の装置の詳細を図1に示す[1]。専用リニアックの短パル ス (~10 ns, 50 Hz) モードで生成された高強度 (~10<sup>6</sup> e<sup>+</sup>/s) の低速陽電子ビームを,アルカリ金属を蒸着したタングス テン標的に入射して Ps 負イオンを生成する。これを電場 で加速した後、レーザー光を照射して電子1個を光脱離さ せる。光脱離によって生成された中性の Ps をマイクロチ ャンネルプレートで検出すことで、Ps 負イオンと光子の 相互作用を調べることができる。また Ps 負イオンを電場 で加速した後に光脱離して、Psのエネルギー可変ビーム を得ている。この実験ではアルカリ金属蒸着した標的を用 いるため,装置内は1×10<sup>-8</sup> Pa 程度の真空が維持されてい る。

### 2. 整備開発および運用状況

Ps 負イオンは陽電子 1 個と電子 2 個からなる束縛状態 である。三体の束縛系を理解する上で大変重要な研究対象 で,1946年に J. Wheeler [2] によって存在が予測されて 以来,数多くの理論的研究が行われてきた。実験的検証は 1981年に A. P. Mills, Jr. [3] によって行われたが,生成効 率が僅か 0.03% と低く,その後の実験は殆ど行われてい



図1 Ps 負イオン実験装置 [7]

なかった。2008 年度に東京理科大学の Y. Nagashima ら [4] のグループが、アルカリ金属を蒸着したタングステンを用 いて Ps 負イオンの生成効率を2桁増やすことに成功して 以来, SPF を中心に行われた研究で, 大きな成果が挙がっ ている。まず、ポジトロニウム飛行時間(Ps-TOF)測定 装置を用いて、レーザービームによる Ps 負イオンの光脱 離が実現された [5]。その後、一階のクライストロンギャ ラリー実験室の本汎用ステーション(SPFB1)に整備され た装置で、エネルギー可変 Ps ビームの生成実験が行われ た[6]。ここでは Ps 負イオンを電場で加速してから光脱 離させることで,所望のエネルギーを有する単色の Ps ビ ームを得る方法が用いられた。さらに、Ps 負イオン生成 ターゲットの最適化 [1] も行われた。引き続き、レーザ ー光の波長をスキャンしながら光脱離した Ps の生成量か ら Ps 負イオン光脱離の断面積が測定され、理論で予想さ れていた形状共鳴によるピークが観測された[7]。この結 果は、世界初の Ps 負イオンの本格的なレーザー分光とし て、世界中から大きな注目を浴びている。

これらの実験が成功したのは、SPF 低速陽電子ビームの 大強度かつショートパルスである特性が、Ps 負イオンの 光脱離に必要なナノ秒レーザーの時間特性と合致してお り、レーザー光と同期した実験が可能であったためである。

Ps 負イオンの共鳴には、上で述べた形状共鳴の他に、 より線幅が狭いフェッシュバッハ共鳴が存在することが予 測されている。フェッシュバッハ共鳴のエネルギーは量子 電気力学によって計算されるため、これを正確に測定すれ ば量子電気力学の検証を行うことが可能である。また、Ps 負イオンの光脱離によって生成される Ps ビームは物性研 究への応用が可能である。特に Ps は電気的に中性である ため、絶縁体や磁性体表面のプローブとして有効であると 考えられる。

#### 3. ビームタイム利用状況

SPFでは、一台の専用リニアックを用いて生成した 低速陽電子ビームを下流で分岐し、4本のビームライン (SPF-A3, A4, B1, B2)で、ビームタイム毎のタイムシェア 形式で共同利用に供している。本ビームライン利用課題は 「(S2)ポジトロニウム負イオン光脱離実験の新展開とエネ ルギー可変ポジトロニウムビームの応用」、「(G)金属薄 膜を用いた低エネルギーポジトロニウムビームの生成とそ の応用」である。形状共鳴の研究の後、それまで並行して 東京理科大学で開発されていた Ps 負イオン実験用の放射 性同位体陽電子源(<sup>22</sup>Na)を利用したパルス陽電子装置が 完成したので、Ps 負イオン実験の中心はそちらに移った。

# 4. 今後の展望

本汎用ステーションは、レーザー設置用の定盤を置くス ペースが確保されているために、レーザーを利用したさま ざまな Ps や Ps 負イオンの実験が可能である。東京理科大 学での研究の進展によって将来 SPF の低速陽電子ビーム の強度を必要とする研究が再開される可能性もある。また、 新規ユーザーによって、本ステーションを利用した Ps の レーザー冷却の研究も構想されている。

# 引用文献

- K. Michishio, R. H. Suzuki, K. Wada, I. Mochizuki, T. Hyodo, A. Yagishita, and Y. Nagashima Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. A, 785, 5 (2015).
- [2] J.A. Wheeler, Ann. New York Acad. Sci. 48, 219 (1946).
- [3] A.P. Mills, Jr., Phys. Rev. Lett. 46, 717 (1981).
- [4] Y. Nagashima, Phys. Rep. 545, 95 (2014). 及び引用文献.
- [5] K. Michishio, T. Tachibana, H. Terabe, A. Igarashi, K. Wada, T. Kuga, A. Yagishita, T. Hyodo, and Y. Nagashima, Phys. Rev. Lett. **106**, 153401 (2011). http://www2.kek. jp/ja/news/press/2011/Positronium.html (KEK プレスリリース), http://www2.kek.jp/ja/news/highlights/2011/Positronium.html (KEK ハイライト).
- [6] K. Michishio, T. Tachibana, R. H. Suzuki, K. Wada, A. Yagishita, T. Hyodo, and Y. Nagashima, Appl. Phys.Lett. 100, 254102 (2012). http://www.kek.jp/ja/NewsRoom/Release/20120620140000/ (KEK プレスリリース).
- [7] K. Michishio, T. Kanai, S. Kuma, T. Azuma, K. Wada, I. Mochizuki, T. Hyodo, A. Yagishita, and Y. Nagashima, Nat. Commun. 7, 11060 (2016). http://www.kek.jp/ja/NewsRoom/Release/20160318103000/ (KEK  $\mathcal{T} \cup \mathcal{I} \cup \mathcal{I}$ ) $\mathcal{U} \mathcal{I}$ ).

\* 現所属 産業技術総合研究所

# SPF-B2:ポジトロニウム飛行時間測定ステーション

兵頭 俊夫<sup>1</sup>,望月 出海<sup>1</sup>,長嶋 泰之<sup>2</sup>,飯田 進平<sup>2\*</sup> <sup>1</sup>物質構造科学研究所放射光科学第一研究系,<sup>2</sup>東京理科大学

#### 1. 概要

本ステーションでは、低速陽電子実験施設(slow-positron facility, SPF)の専用リニアックの短パルスモード(幅 ~10 ns, 50 Hz)で生成された高強度の低速陽電子ビームを 試料に入射し、試料表面から放出されるポジトロニウム (Ps,電子と陽電子の水素原子様束縛状態)の飛行時間ス ペクトルを測定する。これにより、Ps 生成のメカニズムや、 物質中(絶縁体)や物質表面(絶縁体・金属)の電子状態 について調べる「ポジトロニウム飛行時間測定(Ps-TOF)」 の実験が行われている。何度か改修を行った後の、現在の 装置の概要を図1に示す[1]。

低速陽電子を物質中に入射すると,陽電子はすぐには消滅せず,ほとんどは内部で熱化してから電子と対消滅するが,その一部は表面に戻ってくる。その陽電子のさらに一部は,表面で電子を捕獲し,Psを形成して放出される。試料が絶縁体の場合は,内部で生成されたPsが消滅前に表面に達して放出されることもある。放出されたPsのうち,オルソPs(真空中の寿命142 ns)が飛行中に自己消滅したときに放出されるγ線を,試料から水平距離で4 cm あるいは 12 cm 離れた位置に置かれたシンチレーション検出器で検出する。表面からはパラPs(真空中の寿命は 125 ps)も放出されるが,寿命が短いので,表面のすぐ近傍で消滅してしまう。

シンチレーション検出器の前には鉛スリットが置かれて おり,それを通してシンチレータが見込む狭い視野の範囲 内をオルソ Ps が通過する際に自己消滅した消滅γ線のみ が検出される。シンチレーション検出器に取り付けられた 光電子増倍管からの信号をデジタイザで取り込み,リニア ックからの信号をトリガーにして飛行時間スペクトルを得



図1 ポジトロニウム飛行時間測定装置[1]

る。測定チェンバーの真空度は 1×10<sup>-8</sup> Pa である。

#### 2. 整備開発および運用状況

Ps-TOF 装置は,SPF における最初の測定ステーション として 1995 年度に開発された。当時はトリスタンやフォ トンファクトリーと同じ電子・陽電子入射器を利用して得 られる低速陽電子が用いられた。その最初の実験として, 1996 年度に SiO<sub>2</sub> 表面からの Ps-TOF 測定が行われた [2]。 当時,SiO<sub>2</sub> 表面から放出される Psのエネルギーについて, 1 eV と 3 eV の 2 つの値が報告されていた。この実験によ って,SiO2 単結晶およびアモルファス SiO<sub>2</sub> のいずれの表 面からも 1 eV と 3 eV の Ps が放出されるという結果が得 られた。また,以前の実験法ではその片方しか測定できな かったことの説明も与えられた。

それらの研究の後,本装置は 1998 年度に陽電子入射器 棟の地階のテストホールに移設され,2002 年に低速陽電 子生成専用の加速器となる「テストリニアック」がテスト ホールに移設された。さらに,低速陽電子ビームの強度が 10 倍になった後の 2012 年度には,Ps 負イオン実験装置と ともに本装置も一階のクライストロンギャラリー実験室に 移設され,現在のビームライン SPF-B2 に接続された。

最近では、金属表面から放出される Ps の飛行時間測定 が行われている。近年、W 表面に低速陽電子ビームを入 射すると、0.01% 程度の Ps 負イオン(陽電子1個と電子2 個の束縛状態)も放出されること、および W 表面にアル カリ金属を蒸着すると、その放出量が2桁以上も増大する ことが見出された [3]。この機構を解明するために、アル



図 2 W(110) 清浄表面と Na を蒸着した表面の Ps-TOF スペクト ル [1]。

カリ金属を蒸着した W から放出される Ps の飛行時間分布 を測定したところ Ps の放出量も飛躍的に増大しているこ とがわかった [4]。引き続く詳細な研究により, この Ps の, 電子と陽電子の仕事関数で決まる最大エネルギーは変わら ないが,一部エネルギー損失を受けた成分が含まれている ことが明らかになった(図 2) [1]。

## 3. ビームタイム利用状況

SPF では、一台の専用リニアックを用いて生成した 低 速陽電子ビームを下流で分岐し、4本のビームライン (SPF-A3, A4, B1, B2)で、ビームタイム毎のタイムシェア 形式で共同利用に供している。本ビームライン利用課題は 「(G) ポジトロニウム飛行時間測定法によるスピントロニ クス材料表面電子状態の測定」」「(G) ゲルマニウム単結 晶表面からのポジトロニウム放出プロセスの解明」である。

# 4. 今後の展望

表面から放出される Ps は,電子のバンド構造や表面近傍の電子密度,表面プラズモン,あるいは陽電子のエネル ギー準位に関する情報を有しており,その測定は固体の性 質を理解する上で重要である。また表面から放出される Ps は,Ps そのものの性質を調べたり反物質を合成したり する場合に重要な役割を演じるが,その生成機構について はわかっていないことが多い。上述のように,Ps 飛行時 間測定ステーションではその解明に向けての第一歩を踏み 出した。今後は,より詳細な解明を行っていくことが検討 されている。

#### 引用文献

- S. Iida, K Wada, I Mochizuki, T Tachibana, T Yamashita, T Hyodo, Y Nagashima, J. Phys.: Condens. Matter 28, 475002-1-4 (2016)
- [2] Y. Nagashima, Y. Morinaka, T. Kurihara, Y. Nagai, T. Hyodo, T. Shidara, and K. Nakahara, Phys. Rev. B 58, 12676 (1998).
- [3] Y. Nagashima, Phys. Rep. 545, 95 (2014).
- [4] H. Terabe, S. Iida, T. Yamashita, T. Tachibana, B Barbiellini, K. Wada, I. Mochizuki, A. Yagishita, T. Hyodo, Y. Nagashima, Surf. Sci. 641, 68 (2015).
- \* 現所属 立教大学理学部